

Title (en)

X-ray examination apparatus with an x-ray source and an associated diaphragm unit

Title (de)

Röntgenuntersuchungsgerät mit einem Röntgenstrahler und einer damit verbundenen Blendeneinheit

Title (fr)

Appareil d'examen à rayons X avec une source à rayons X en association avec une unité de diaphragme

Publication

EP 0794536 A1 19970910 (DE)

Application

EP 97200651 A 19970305

Priority

DE 19608862 A 19960307

Abstract (en)

The X-ray diagnostic device has an X-ray source; an image generator; an aperture system, which limits the width of the beams (100,200) from one or other of two sources (1,2); and a control system which operates a motor-drive which adjusts the position of the shutters (6), where the novelty is that the control system ensures that the shutters (6) take up a first position (h1), with the X-ray beam (101) and a second position (h2) with the second X-ray bundle (200), such that, in the plane of the image generator (9), the fields of the two sources (1,2) have, approximately the same height (H).

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Röntgenuntersuchungsgerät mit einem Röntgenstrahler (3,4) zur Erzeugung von Röntgenstrahlung und einer mit dem Röntgenstrahler (3,4) verbundenen Blendeneinheit (5) mit durch eine Antriebsanordnung (11,12) verstellbaren Blendenschiebern (6) zur Begrenzung des von einer ersten Quelle (1) oder einer zweiten Quelle (2) ausgehenden Strahlenbündels (100,200) und mit einer die Antriebsanordnung steuernden Steuereinheit (13). Dabei läßt sich eine Übereinstimmung zwischen den von den beiden Quellen ausgehenden Strahlenfeldern auch bei unterschiedlicher Größe der Quellen dadurch erreichen, daß die Steuereinheit (13) die Antriebsanordnung (11,12) so steuert, daß die Blendenschieber bei der Begrenzung des Strahlenbündels (101) der ersten Quelle (1) eine erste (h1) und bei der Begrenzung des Strahlenbündels (200) der zweiten Quelle (2) eine zweite Stellung (h2) einnehmen, wobei die erste und die zweite Stellung derart sind, daß die durch die Blendenschieber ausgeblendeten Strahlenfelder der ersten und der zweiten Quelle jeweils die gleiche Größe (H) aufweisen. <IMAGE>

IPC 1-7

G21K 1/04; **A61B 6/06**; **H05G 1/26**

IPC 8 full level

G01N 23/04 (2006.01); **A61B 6/06** (2006.01); **G03B 42/02** (2006.01); **G21K 1/04** (2006.01); **G21K 5/02** (2006.01); **H05G 1/26** (2006.01)

CPC (source: EP US)

G21K 1/04 (2013.01 - EP US); **H05G 1/26** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] DE 2124035 A1 19721123
- [Y] FR 2721789 A1 19951229 - GE MEDICAL SYST SA [FR]
- [AD] EP 0685200 A1 19951206 - SIEMENS ELEMA AB [SE]
- [AD] GB 1313296 A 19730411 - PHILIPS ELECTRONIC ASSOCIATED
- [A] EP 0184695 A1 19860618 - SIEMENS AG [DE]
- [A] EP 0142841 A2 19850529 - TOSHIBA KK [JP]
- [A] FR 2634094 A1 19900112 - GEN ELECTRIC CGR [FR]

Cited by

DE29710724U1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB NL

DOCDB simple family (publication)

EP 0794536 A1 19970910; **EP 0794536 B1 20011004**; DE 19608862 A1 19970911; DE 59704742 D1 20011108; JP H1026805 A 19980127; US 5844962 A 19981201

DOCDB simple family (application)

EP 97200651 A 19970305; DE 19608862 A 19960307; DE 59704742 T 19970305; JP 4906697 A 19970304; US 80859497 A 19970228